

! New !

小型 / 高速 / 簡易検査

ガラス・ウェハー欠陥検査ユニット

DG-U

概要

ガラス基板やベアウェハーなど
透明製品の欠陥を**表裏面と内部に分けて検出**
コンパクトな卓上型検査ユニットが新登場

SiC / GaN / ダイヤモンド

カバーガラス（シースルー製品）

対象製品例



ガラス基板 / マスク パワーデバイス

半導体センサ ディスプレイ ウェアラブル機器

透明体欠陥検査ユニット

特長

■ 高速 / 高精度

微小欠陥を**高速自動検査**

■ 自動 / 省人化

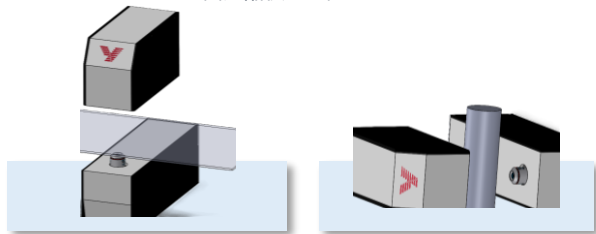
顕微鏡目視検査の代替 さらに**良否判定が可能**

■ 縦横両置きが可能

小型モデルで**自由度の高い設置**を実現

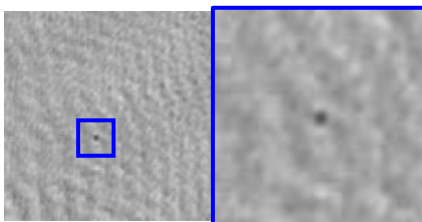
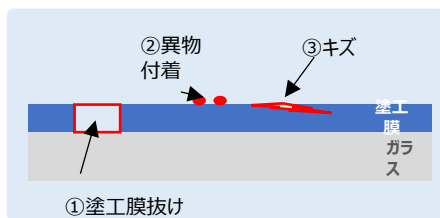
性能	視野	分解能	検査時間	設置形態
DG-U	□ 5 mm	1 μm	13 分	縦or横置き
顕微鏡	□ 11 μm	0.1 nm	4 時間	横置き

□150mmサイズの全面欠陥検査時間

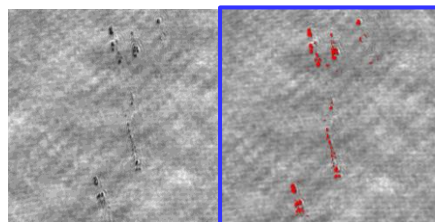


活用例

1) ガラス表面の **傷、異物、コート抜け** 検査

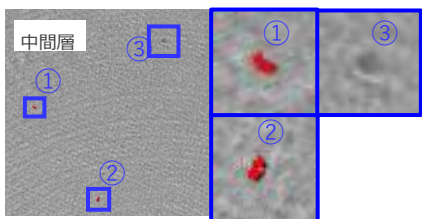
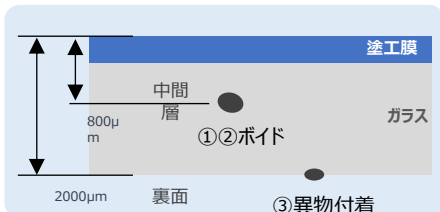


①塗工膜抜け：φ5μm

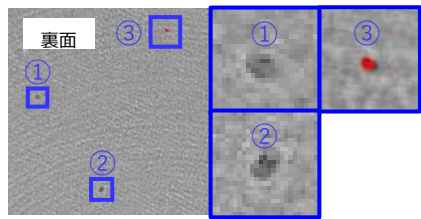


②異物③キズ：20μm²以上 x 複数個

2) ワークの**中間層、裏面の欠陥**を階層別に**1shotで同時に検出**



①②ポイド欠陥 深さ位置：800μm



③異物付着 深さ位置：2000μm

